Search	Notes
III 	



Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/576,059	LANTZSCH ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Jennifer Y. Cho	1621	

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
560	170	2/2/2007	1C	
			-	
444				
,				
		2		
	<u> </u>			

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

SEAR((INCLUDING SE	CH NOTES ARCH STRA	ATEGY)	
		ATE	EXMR
East Search	2/2	/2007	JC
STN Search	2/2	2/2007	KS
STN Search	1/2	9/2007	BS
·.			
		·	
		· · · · · ·	
· ·			